



## 2. Schwerpunkttreffen

„NANOANALYTIK FÜR FORSCHUNG UND INDUSTRIE“

am 07.12.2005

Die Nanoanalytik von Materialien mit modernen abbildenden und spektroskopischen Verfahren ist für die Entwicklung von Funktionsmaterialien, Dünnschichtsystemen und Nanomaterialien und für die Erforschung der Zusammenhänge zwischen Materialstruktur und Eigenschaften von enormer Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die Zukunftsbereiche Materialforschung, Oberflächenforschung, Nanowissenschaften und Nanosystemtechnik sowie für Anwendungen in der Materialanalytik zur Produktentwicklung für die Wirtschaft. Die Veranstaltung wird einige der in der norddeutschen Region vorhandenen Kompetenzen in der modernen Nanoanalytik von Materialien und das Potenzial für Anwendungsfelder in Forschung und Industrie vorstellen.

**Ort:** Technische Fakultät (TF) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  
Kaiserstraße 2, 24143 Kiel  
Vortragsraum 'Aquarium' (Gebäude D)

**Zeit:** 14:00 - ca. 19:00 Uhr

**Gastgeber:** Prof. Dr. Wolfgang Jäger – Lehrstuhl für Mikrostrukturanalytik

- **14:00 - 15:00 Uhr** Centrum für Materialanalytik (CMA) - Rundgang durch die Labore

Möglichkeit zum Rundgang durch die Labore des Centrum für Materialanalytik (CMA) der Technischen Fakultät mit den Methoden Transmissionselektronenmikroskopie TEM, Raster-elektronenmikroskopie REM, Photoelektronenspektroskopie XPS und konfokale Mikroskopie für die Oberflächenanalytik.

Optional besteht die Möglichkeit zur Besichtigung weiterer Labore der Arbeitsgruppen der Materialwissenschaft. Weitere Informationen dazu unter [www.tf.uni-kiel.de](http://www.tf.uni-kiel.de).

- **15:00 - 18:00** Vortragsveranstaltung

15:00 - 15:10

**Begrüßung und Einführung**

Prof. Dr. F. Faupel NINa-Initiative der ISH  
Prof. Dr. W. Jäger Programm der Veranstaltung

15:10 - 15:40

**Prof. Dr. Roland Wiesendanger** - Institut für Angewandte Physik und Zentrum für Mikrostrukturforschung, Universität Hamburg  
*„Nanoanalytik mittels Rastersonden-Methoden: Von der Grundlagenforschung zur industriellen Anwendung“*

15:40 - 16:10

**Prof. Dr. Hans Peter Oepen** - Institut für Angewandte Physik, Universität Hamburg  
*„Hochfokussierte Ionenstrahlen (FIB) in der Oberflächen- und Dünnschichttechnik“*

16:10 - 16:40

**Prof. Dr. Wolfgang Jäger** - Mikrostrukturanalytik, Technische Fakultät, CAU zu Kiel  
*„Nanoanalytik mit analytischer Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) für Forschung und Industrie“*

16:40 - 17:00

**Diskussionspause**

17:00 - 17:30

**Dr. Vladimir Zaporozhchenko** - Lehrstuhl für Materialverbunde, Technische Fakultät, CAU zu Kiel  
*„Chemische Analytik mit Photoelektronenspektroskopie“*

17:30 - 18:00

**Dr. Udo Riss** - DRE-Dr. Riss Ellipsometerbau GmbH, Ratzeburg  
*„Ellipsometrie – Vermessung dünner Schichten“*

- **Ab 18:00** Diskussionen - Snacks - Getränke